



Les techniques de caractérisation des surfaces et interfaces se renforcent



Dans le cadre du projet IXIA, soutenu par la région Nouvelle Aquitaine et le projet E2S UPPA, le [plateau XRISE](#) fait évoluer son équipement TOF-SIMS en le dotant d'un nouvel analyseur Tandem MS.

Cet appareil de caractérisation des surfaces permet l'identification élémentaire et moléculaire des espèces présentes en surface à des échelles submicroniques, ainsi que de déterminer leur localisation par imagerie 2D et 3D.

Les applications sont nombreuses notamment dans le domaine des batteries (analyse des interfaces électrodes/électrolyte après fonctionnement), des traitements de surface (caractérisation des défauts, de la chimie de corrosion), de la biologie (imagerie de composés chimiques au niveau cellulaire), etc...

Cet appareil de dernière génération, le 1er opérationnel en France, illustre la montée en puissance en techniques d'identification et d'imagerie moléculaires des laboratoires de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.

